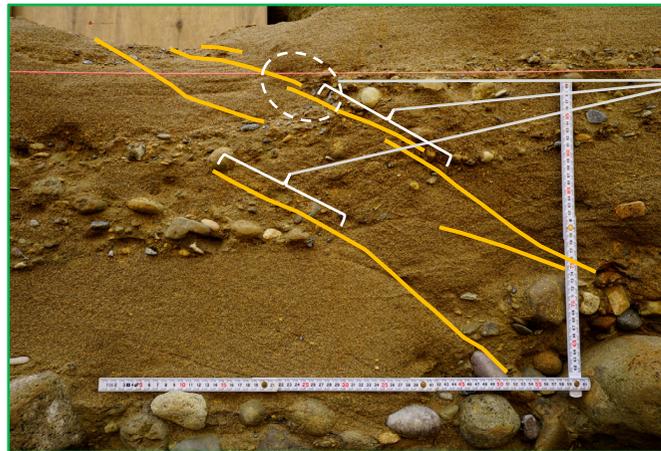


(1)開削調査箇所(北側)

③-1 小断層の上端付近の詳細観察-M1ユニット下部の砂礫層に認められるF-1断層及び小断層による構造(4/4) -



拡大写真②(解釈線なし)



拡大写真②(解釈線あり)

比較的細粒な層相を呈する箇所には、剪断面が認められ、その延長部においては、明瞭な変位を示す箇所(破線囲み位置)が認められる。



拡大写真③(解釈線なし)



拡大写真③(解釈線あり)

F-1断層及び小断層の延長方向に沿った姿勢の礫が認められる。



長軸が剪断面に平行な礫が認められる。

拡大写真④

剪断面

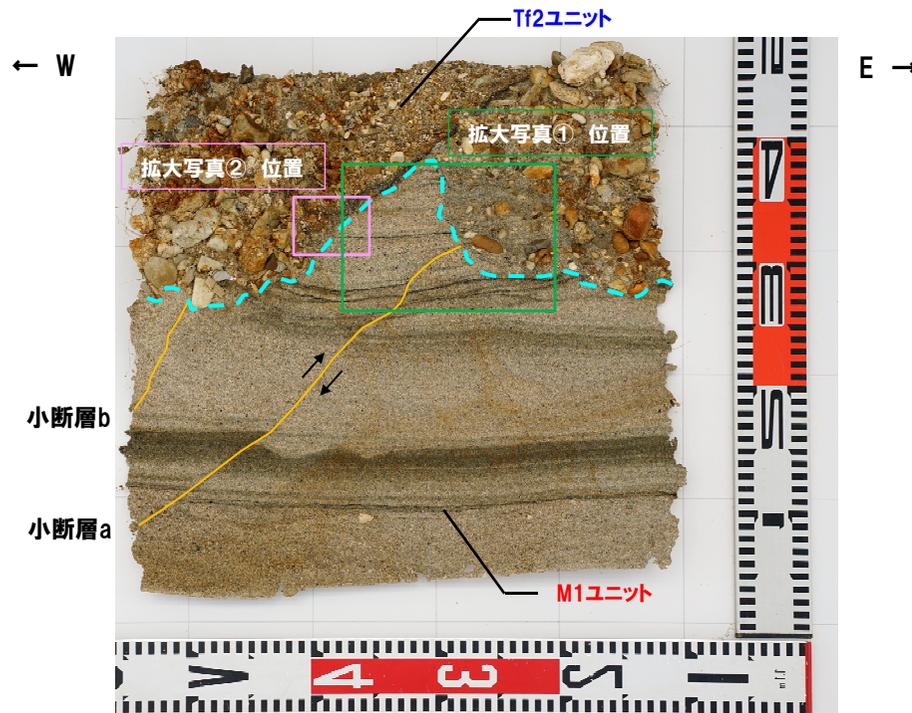
(1)開削調査箇所(北側)

③-2 小断層の上端付近の詳細観察-M1ユニットとTf2ユニットの層相境界 (Tf2ユニットの基底面) 設定の着目点 (1/4) -

一部修正 (R2/8/7審査会合)

【M1ユニットとTf2ユニットの層相境界 (Tf2ユニットの基底面) 設定の着目点】

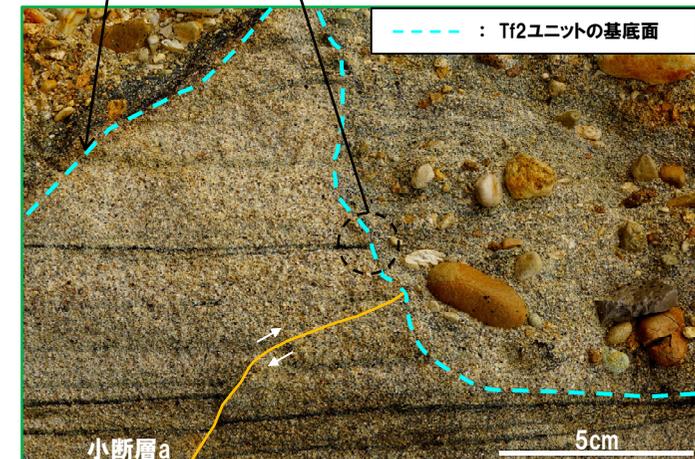
- Tf2ユニットの基底面は、下位のM1ユニットを侵食する侵食面である。
- M1ユニットは淘汰の良い砂層であること及びTf2ユニットがシルトを含む砂礫層であることを踏まえ、以下の状況に着目し、M1ユニットとTf2ユニットの層相境界 (Tf2ユニットの基底面) を設定した。
 - ・Tf2ユニットがM1ユニットの葉理を切断している場合 (例: 拡大写真①並びにP448~P449の拡大写真③及び④参照)。
 - ・Tf2ユニットの基底面付近において、M1ユニットの葉理が不明瞭になる場合 (例: 拡大写真②及びP448~P449の拡大写真③参照)。
 - ・Tf2ユニットに認められるシルト質な基質の分布により、M1ユニットとTf2ユニットの層相に差異が認められる場合 (例: 拡大写真①参照)。



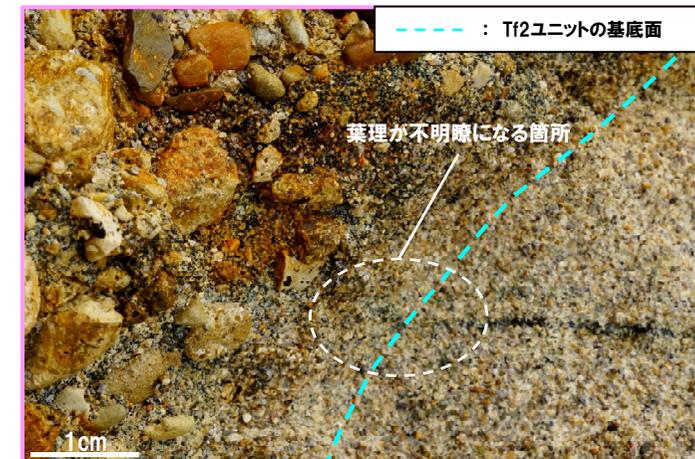
北側壁面追加はぎとり転写試料※ 写真(左右反転)(解釈線あり)

Tf2ユニットに認められるシルト質な基質の分布により、M1ユニットとの層相に差異が認められる箇所

Tf2ユニットがM1ユニットの葉理を切断している箇所



小断層上端付近 拡大写真①(左右反転)(解釈線あり)



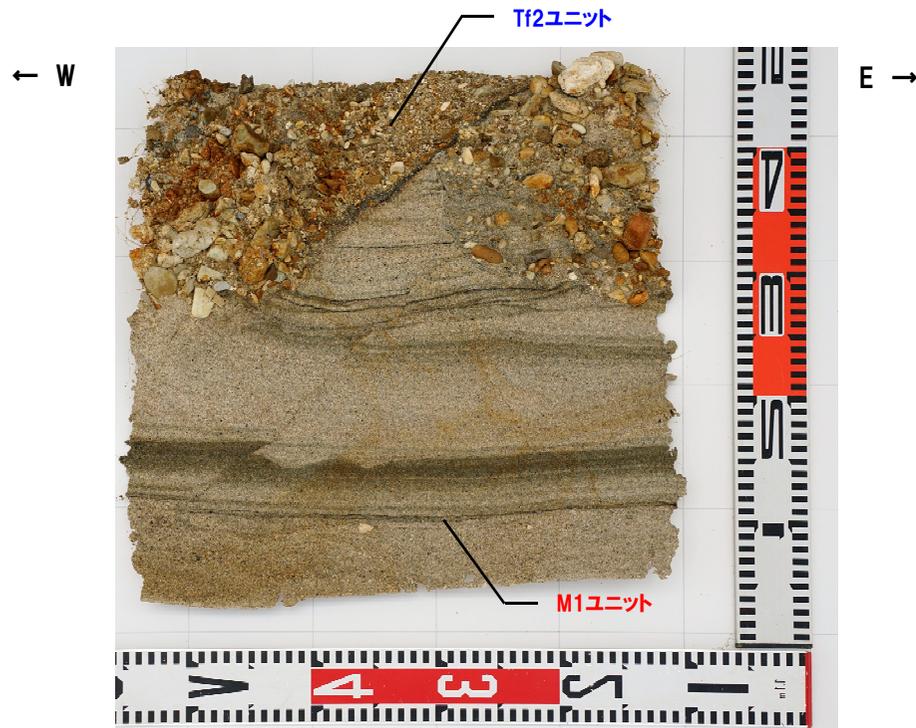
Tf2ユニット基底面付近 拡大写真②(左右反転)(解釈線あり)

※本はぎとり転写試料の作成位置及び詳細観察結果は、P452~P456参照。

(1)開削調査箇所(北側)

③-2 小断層の上端付近の詳細観察-M1ユニットとTf2ユニットの層相境界 (Tf2ユニットの基底面) 設定の着目点 (2/4) -

再掲 (R2/8/7審査会合)



北側壁面追加はぎとり転写試料 写真(左右反転)(解釈線なし)



小断層上端付近 拡大写真①(左右反転)(解釈線なし)

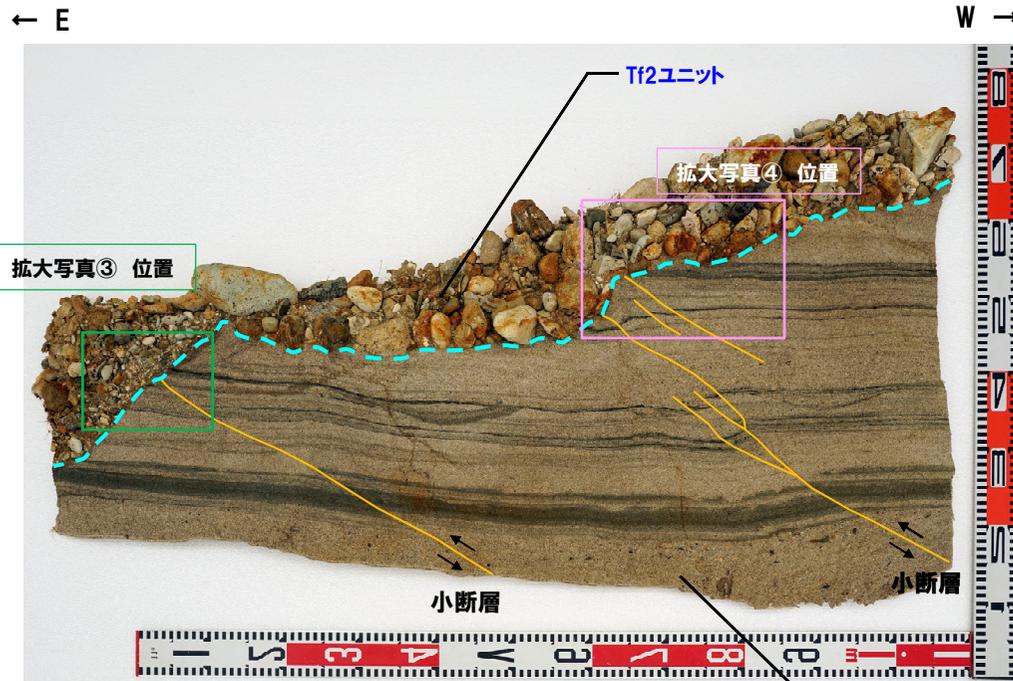


Tf2ユニット基底面付近 拡大写真②(左右反転)(解釈線なし)

(1)開削調査箇所(北側)

③-2 小断層の上端付近の詳細観察-M1ユニットとTf2ユニットの層相境界 (Tf2ユニットの基底面) 設定の着目点 (3/4) -

一部修正 (R2/8/7審査会合)



南側壁面追加はぎとり転写試料* 写真(左右反転)(解釈線あり)



小断層上端付近 拡大写真③(左右反転)(解釈線あり)



Tf2ユニット基底面付近 拡大写真④(左右反転)(解釈線あり)

*本はぎとり転写試料の作成位置及び詳細観察結果は、P458～P461参照。

(1)開削調査箇所(北側)

③-2 小断層の上端付近の詳細観察-M1ユニットとTf2ユニットの層相境界 (Tf2ユニットの基底面) 設定の着目点 (4/4) -

再掲 (R2/8/7審査会合)



はぎとり転写試料 写真 (左右反転) (解釈線なし)



小断層上端付近 拡大写真③ (左右反転) (解釈線なし)

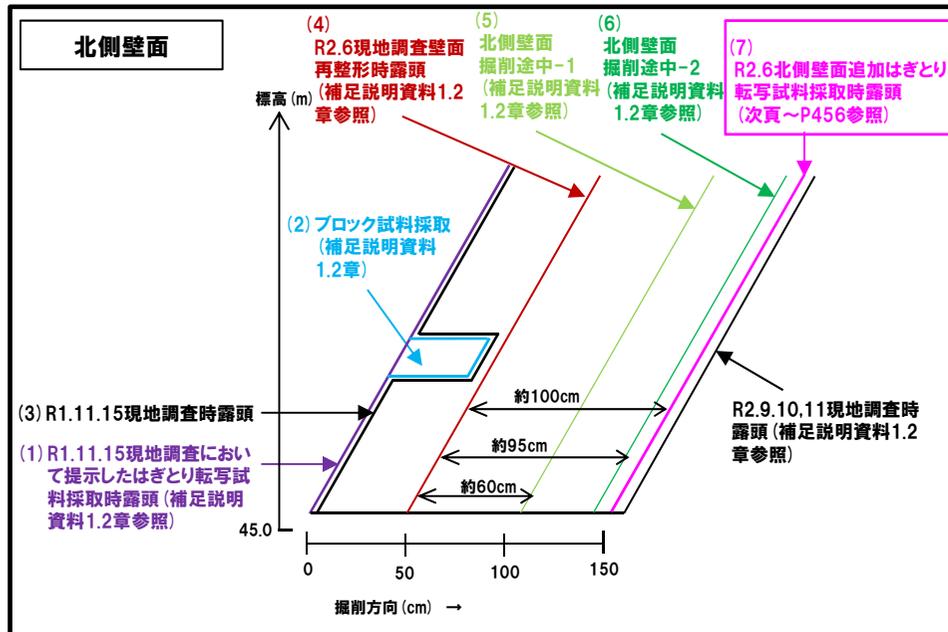


Tf2ユニット基底面付近 拡大写真④ (左右反転) (解釈線なし)

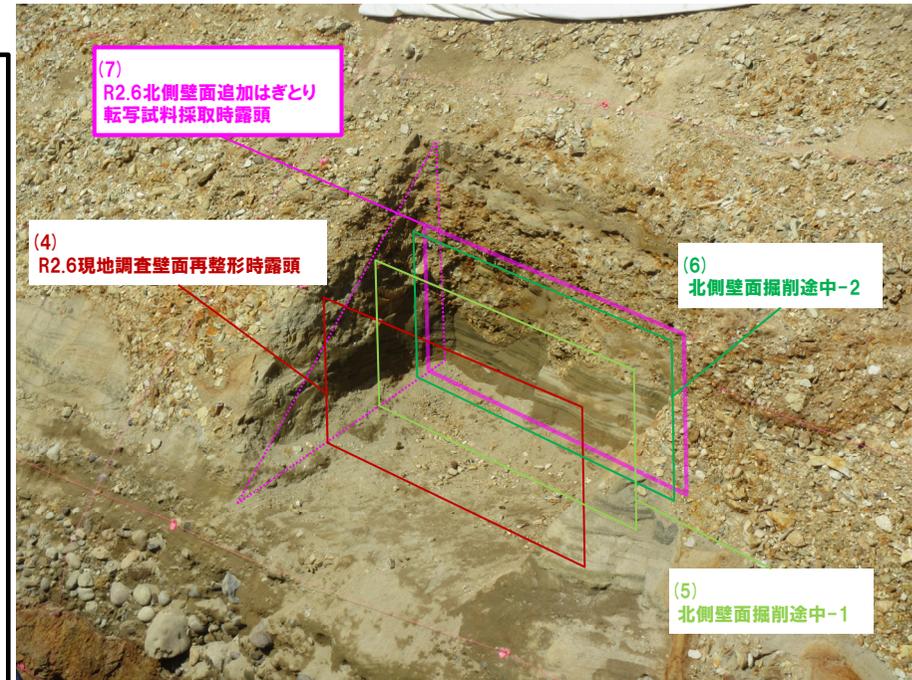
余白

(1)開削調査箇所(北側)

③-3 小断層上端付近の詳細観察-北側壁面はぎとり転写試料作成位置-

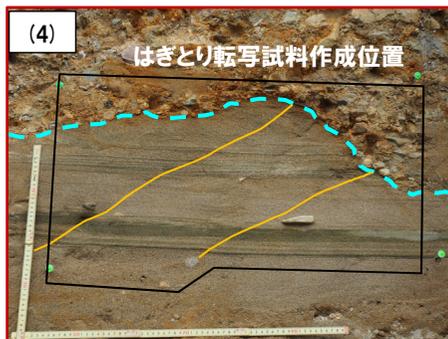


北側壁面 模式断面図



北側壁面 掘削状況 (R2.9撮影)

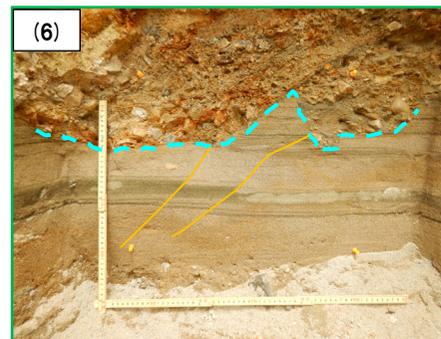
— : 小断層
 - - - : Tf2ユニットの基底面



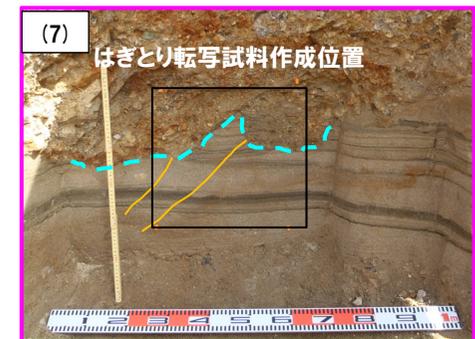
R2.6現地調査壁面再整形時露頭
 (補足説明資料1.2章参照)



北側壁面掘削途中-1
 (補足説明資料1.2章参照)



北側壁面掘削途中-2
 (補足説明資料1.2章参照)



R2.6北側壁面追加はぎとり転写試料
 採取時壁面 (次頁～P456参照)

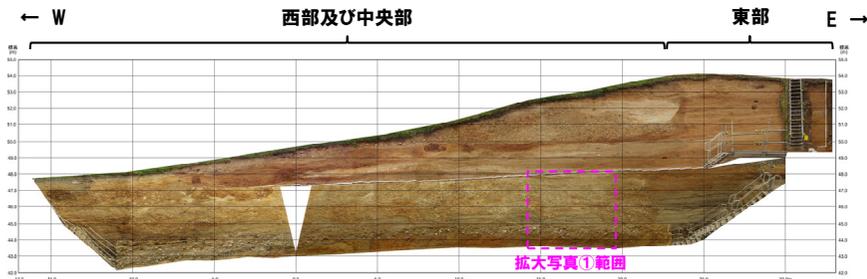
(1)開削調査箇所(北側)

③-4 小断層上端付近の詳細観察-北側壁面追加はぎとり転写試料(1/5)-

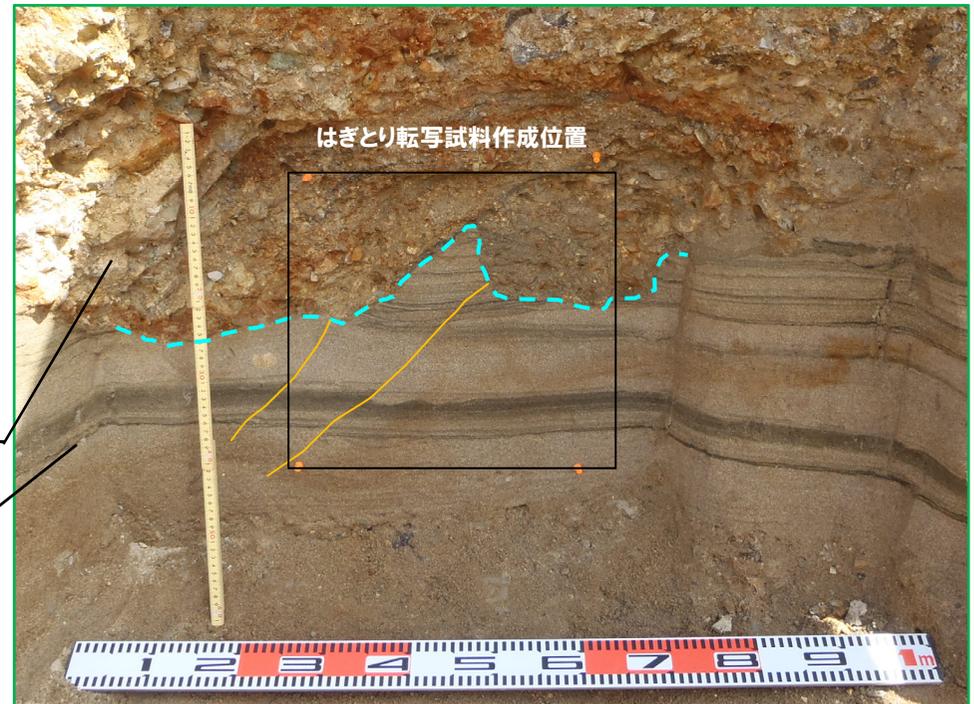
一部修正(R2/8/7審査会合)

(北側壁面追加はぎとり転写試料)

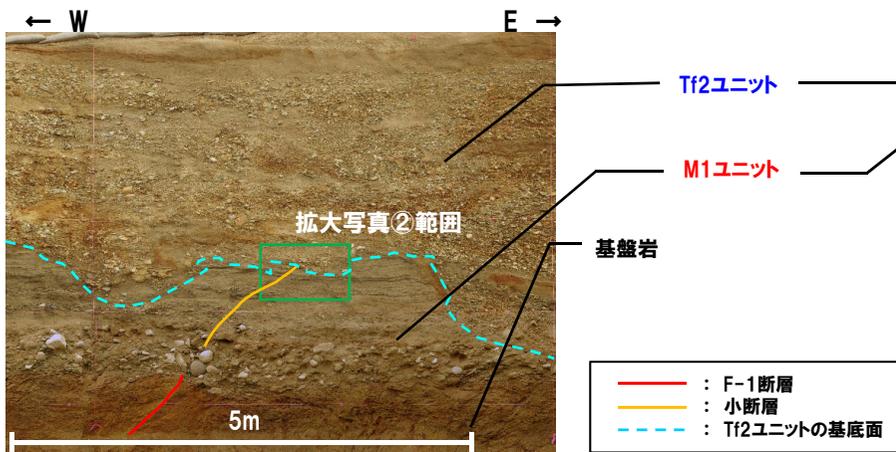
- R1.11.15現地調査時の壁面から奥行き方向に掘削を行い、M1ユニット及びTf2ユニットの層相境界付近において、露頭観察及びはぎとり転写試料を作成し、地質構造の観察を実施した。
- 北側壁面追加はぎとり転写試料は、R1.11.15現地調査時の壁面から約100cm奥行き方向で作成したものである。
- 本はぎとり転写試料は、M1ユニットにおいて、小断層による葉理のズレがTf2ユニットの基底面直下で認められること及びTf2ユニットは砂礫層であるため、Tf2ユニットの基底面直下の変位量が小さい場合においても、小断層による変位・変形の有無が確認できる比較的細粒な層相を呈する断面である。



開削調査箇所(北側)北側壁面写真



拡大写真②(解釈線あり)



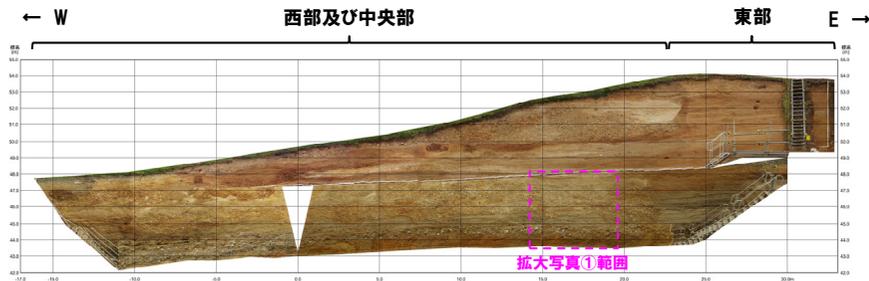
拡大写真①(解釈線あり)

拡大写真①は、R1.11.15現地調査において提示したはぎとり転写試料作成前の写真を案内図として用いている。

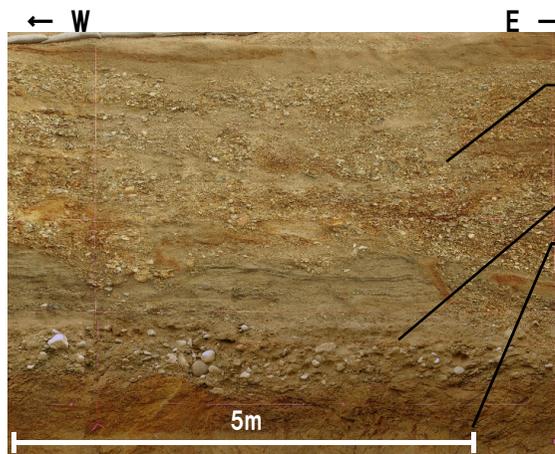
(1)開削調査箇所(北側)

③-4 小断層上端付近の詳細観察-北側壁面追加はぎとり転写試料(2/5) -

一部修正 (R2/8/7審査会合)



開削調査箇所(北側)北側壁面写真



拡大写真① (解釈線なし)

Tf2ユニット
 M1ユニット
 基盤岩



拡大写真② (解釈線なし)

拡大写真①は、R1.11.15現地調査において提示したはぎとり転写試料作成前の写真を案内図として用いている。

(1)開削調査箇所(北側)

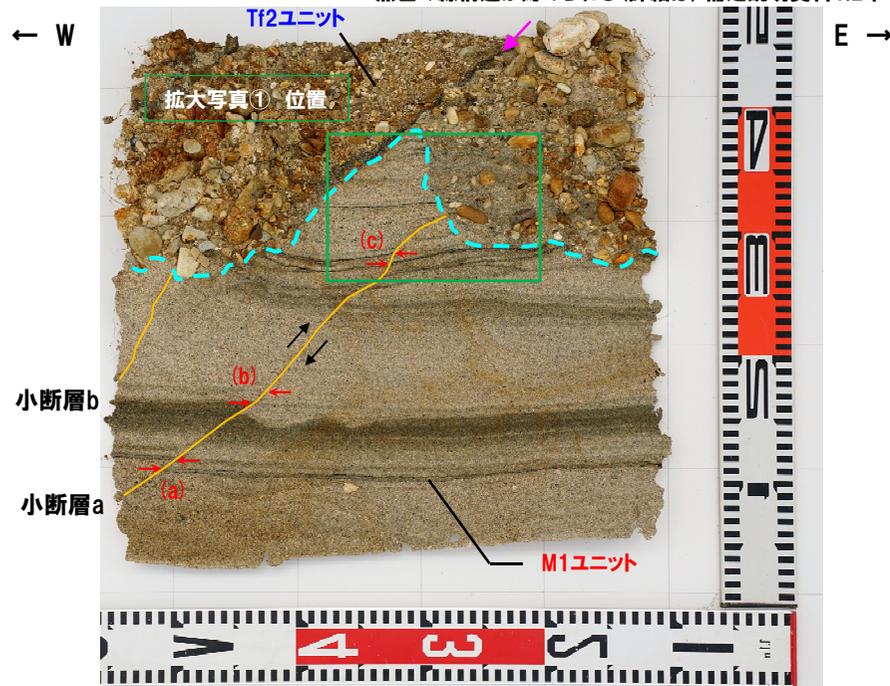
③-4 小断層上端付近の詳細観察-北側壁面追加はぎとり転写試料(3/5) -

一部修正(R2/8/7審査会合)

【観察結果】

- 本はぎとり転写試料は、M1ユニットにおいて、小断層による葉理のズレがTf2ユニットの基底面直下で認められること及びTf2ユニットは砂礫層であるため、Tf2ユニットの基底面直下の変位量が小さい場合においても、小断層による変位・変形の有無が確認できる比較的細粒な層相を呈する断面である。
- F-1断層に関連する小断層は、M1ユニットに変位を与えており、Tf2ユニットの基底面直下まで剪断面が連続し、変位が認められる。
- 小断層に顕著な見かけ変位量の減衰は認められない。
- Tf2ユニットの基底面に、小断層による変位は認められない。
- Tf2ユニット中の比較的細粒な層相を呈する箇所に、剪断面は認められない。
- Tf2ユニットに、堆積構造の乱れは認められない。

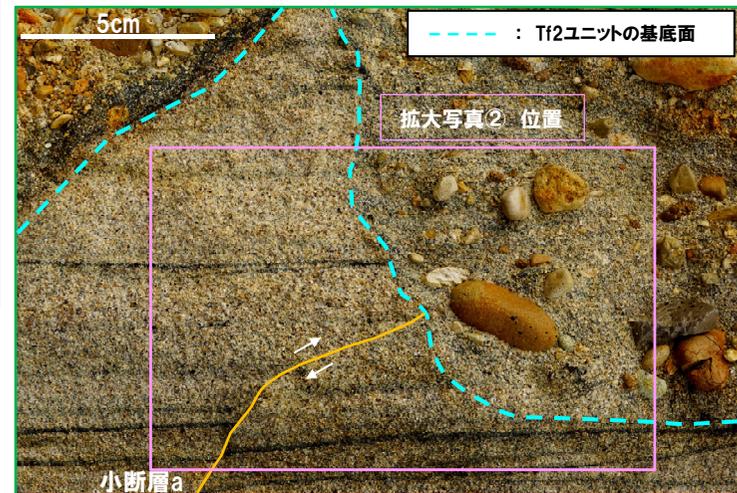
黒色の線構造が認められる(詳細は、補足説明資料1.2章参照)。



はぎとり転写試料 写真(左右反転)(解釈線あり)

← :見かけ変位量の計測箇所(砂層中の葉理のズレ)

見かけ変位量 : (a) 約13mm
(b) 約13mm
(c) 約10mm



小断層a上端付近 拡大写真①(左右反転)(解釈線あり)

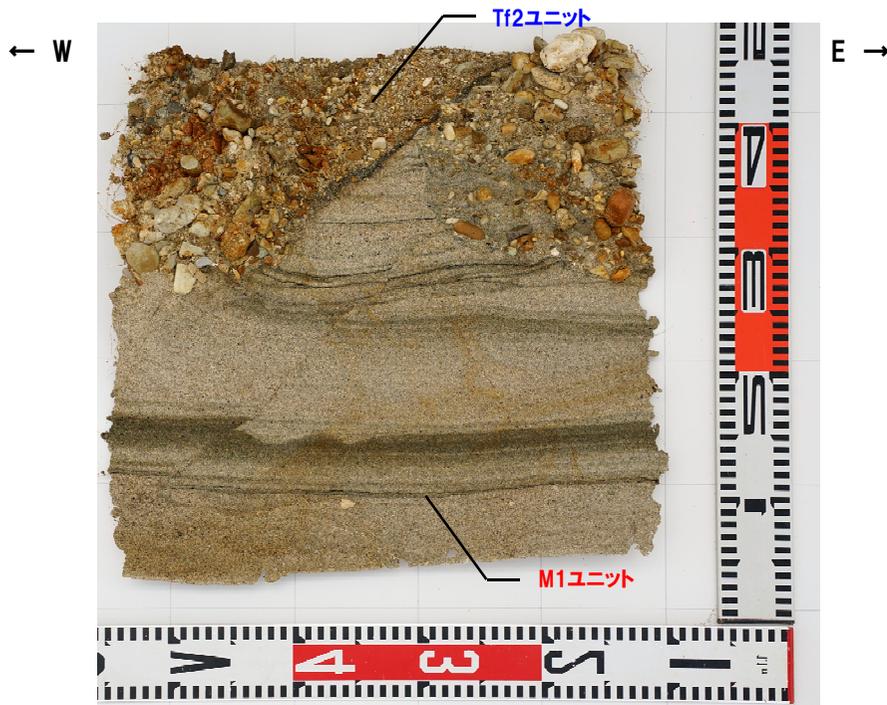


小断層a上端付近 拡大写真②(左右反転)(解釈線あり)

(1)開削調査箇所(北側)

③-4 小断層上端付近の詳細観察-北側壁面追加はぎとり転写試料(4/5) -

再掲(R2/8/7審査会合)



はぎとり転写試料 写真(左右反転)(解釈線なし)



小断層a上端付近 拡大写真①(左右反転)(解釈線なし)



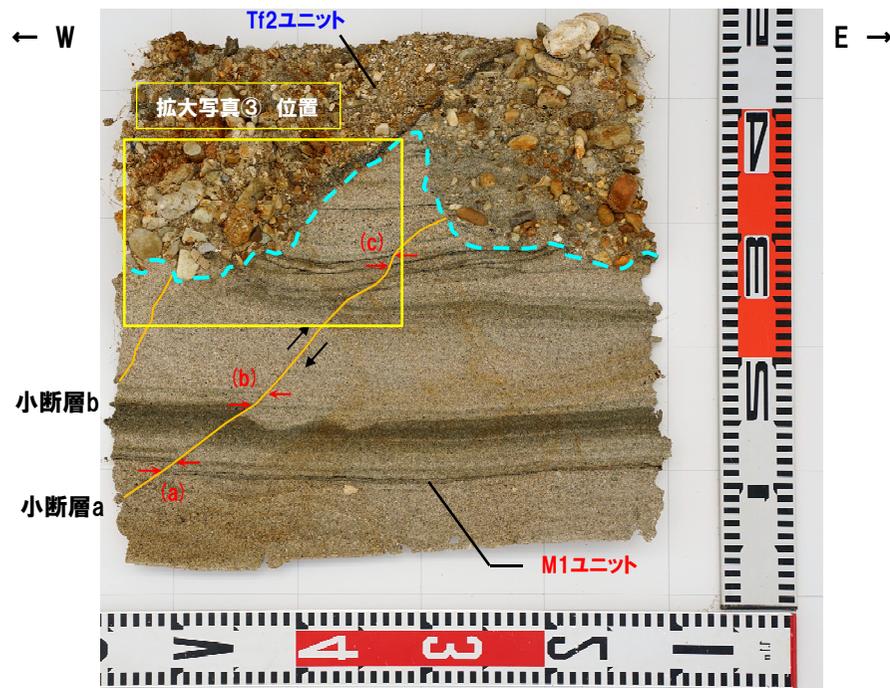
小断層a上端付近 拡大写真②(左右反転)(解釈線なし)

(1)開削調査箇所(北側)

③-4 小断層上端付近の詳細観察-北側壁面追加はぎとり転写試料(5/5) -

再掲(R2/8/7審査会合)

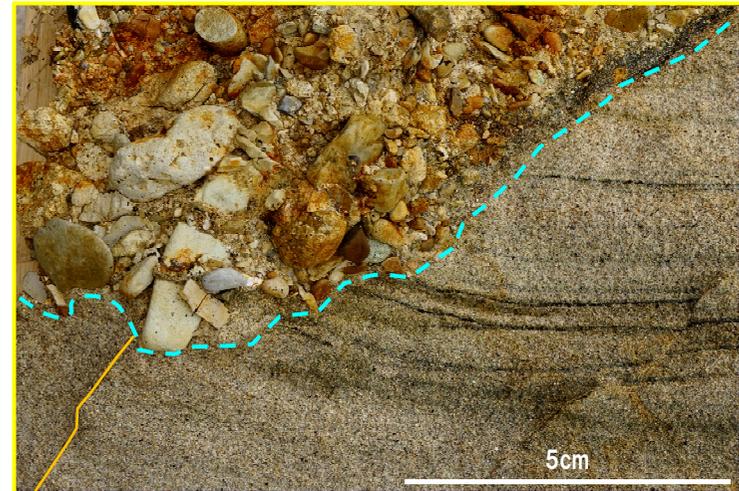
----- : Tf2ユニットの基底面



はぎとり転写試料 写真(左右反転)(解釈線あり)

← : 見かけ変位量の計測箇所(砂層中の葉理のスレ)

見かけ変位量 : (a) 約13mm
(b) 約13mm
(c) 約10mm



小断層b 小断層b上端付近 拡大写真③(左右反転)(解釈線あり)



小断層b上端付近 拡大写真③(左右反転)(解釈線なし)